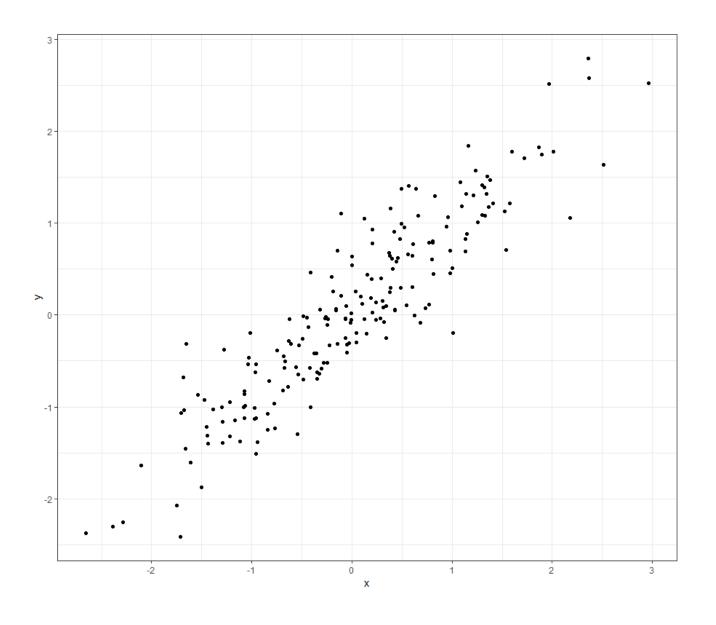
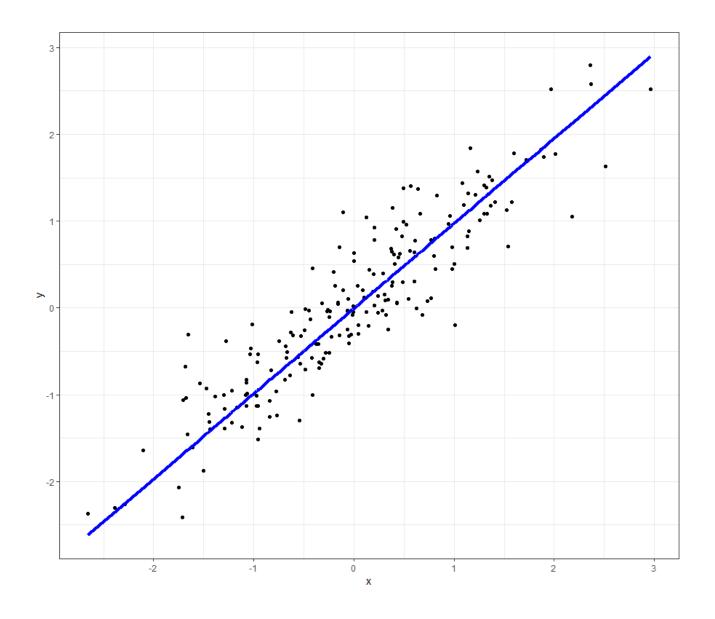
# PCA



#### Problem:

- w wysokowymiarowej przestrzeni dane mogą wyglądać podobnie jak w tym niskowymiarowym przykładzie:

część wymiarów może mieć duży rozrzut (oś x), a część mały (y)

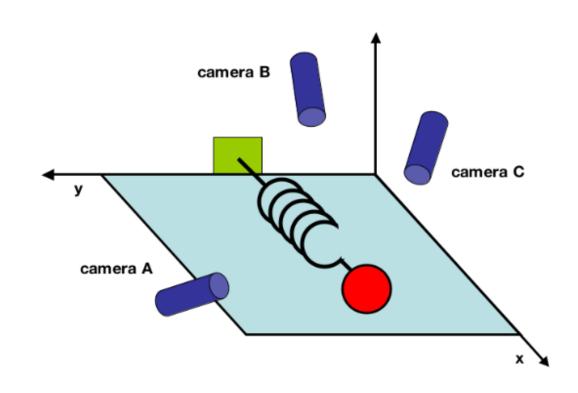


### Rozwiązanie:

- -możemy zredukować opis danych do mniejszej liczby cech.
- -> Jak znaleźć nowe cechy?
- -> Przekształcenie liniowe: rzut

# Jak znaleźć dobrą przestrzeń do rzutu?

- W przykładzie: widać, że na osi y dane mają mały rozrzut, więc intuicyjnie wiemy, że w ten kierunek nie jest ważny.
- Czyli warto szukać kierunków, w których dane mają największy rozrzut.
- Analogia z cieniem



https://www.cs.princeton.edu/picasso/mats/PCA-Tutorial-Intuition jp.pdf

# Rozwiązanie

With this assumption PCA is now limited to reexpressing the data as a linear combination of its basis vectors. Let  $\mathbf{X}$  and  $\mathbf{Y}$  be  $m \times n$  matrices related by a linear transformation  $\mathbf{P}$ .  $\mathbf{X}$  is the original recorded data set and  $\mathbf{Y}$  is a re-representation of that data set.

$$\mathbf{PX} = \mathbf{Y} \tag{1}$$

Also let us define the following quantities<sup>2</sup>.

- $\mathbf{p_i}$  are the rows of  $\mathbf{P}$
- $\mathbf{x_i}$  are the *columns* of  $\mathbf{X}$
- $y_i$  are the *columns* of Y.

- Zakładamy, że P jest ortonormalna
- P jest rzutem

$$\sigma_{\vec{w}}^{2} = \frac{1}{n} \sum_{\cdot} (\vec{x_{i}} \cdot \vec{w})^{2}$$

$$= \frac{1}{n} (\mathbf{X} \mathbf{w})^{T} (\mathbf{X} \mathbf{w}) \quad \frac{\partial u}{\partial w} = 0 = \frac{\partial f}{\partial w} - \lambda \frac{\partial g}{\partial w}$$

$$= \frac{1}{n} \mathbf{w}^{T} \mathbf{X}^{T} \mathbf{X} \mathbf{w} \qquad \frac{\partial u}{\partial \lambda} = 0 = -(g(w) - c)$$

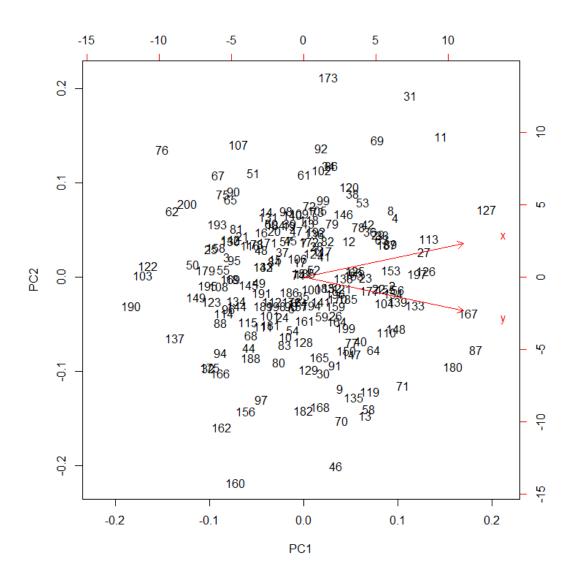
$$= \mathbf{w}^{T} \frac{\mathbf{X}^{T} \mathbf{X}}{n} \mathbf{w} \qquad u = \mathbf{w}^{T} \mathbf{V} \mathbf{w} - \lambda (\mathbf{w}^{T} \mathbf{w} - 1)$$

$$= \mathbf{w}^{T} \mathbf{V} \mathbf{w} \qquad \frac{\partial u}{\partial \mathbf{w}} = 2 \mathbf{V} \mathbf{w} - 2 \lambda \mathbf{w} = 0$$

$$\mathbf{V} \mathbf{w} = \lambda \mathbf{w}$$

# Co dalej?

- Wniosek: najlepsza baza dla danych w tym problemie jest rozpięta przez wektory własne macierzy kowariancji.  $R^2 \equiv \frac{\sum_{i=1}^q \lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i}$
- Ile wektorów należy wziąć?
- Procent objaśnionej wariancji: (Pytanie pomocniczne: jaka jest wariancja nowych zmiennych?)
- Tradycyjne kryterium: wybór tylu składowych głównych, żeby błąd przybliżenia był mniejszy niż zadana wielkość = wyjaśniona wariancja większa niż ustalony odsetek.



# Biplot

### Zadania

- Przeprowadzić PCA z pomocą funkcji eigen
- Porównać wyniki z wynikami działania funkcji prcomp i princomp.
- Sprawdzić znaczenie elementów obiektów zwracanych przez te funkcje.
- Bonus: jaka jest korelacja między składową główną a oryginalną zmienną?

### Sensowne materialy

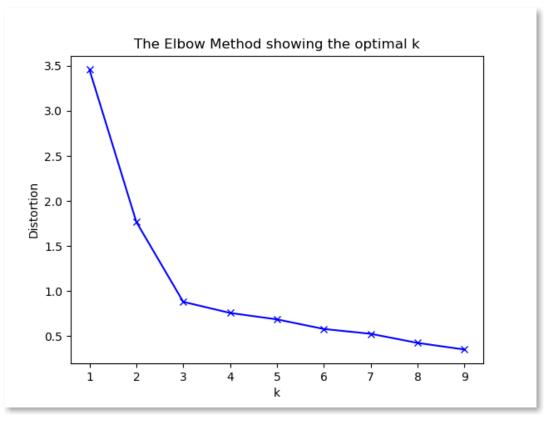
- http://stat.cmu.edu/%7Ecshalizi/350/lectures/10/lecture-10.pdf
- https://www.cs.princeton.edu/picasso/mats/PCA-Tutorial-Intuition\_jp.pdf
- http://www.sthda.com/english/articles/31-principal-componentmethods-in-r-practical-guide/112-pca-principal-component-analysisessentials/

# Analiza skupień

Liczba klastrów + ocena konkretnego pogrupowania

# Elbow plot

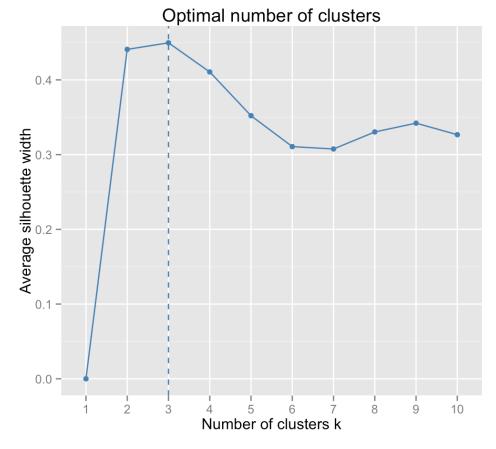
- Obliczyć klastry dla wielu wartości k
- Dla każdego k obliczyć łączną sumę odchyleń wewnątrz klastrów SSE
- Narysować wykres zależności SSE od k.
- Miejsce, od którego zmiany w SSE są malutkie uznajemy za dobrą liczbę klastrów



https://pythonprogramminglanguage.com/kmeans-elbow-method/

# Average silhouette method

- Obliczyć podział na k klastrów dla wielu k.
- Obliczyć średnią wartość stat. silhouette dla każdego k (sil).
- Narysować wykres zależności sil od k.
- Najlepsza liczba klastrów jest położona w maksimum wykresu.



https://www.datanovia.com/en/lessons/determining-theoptimal-number-of-clusters-3-must-know-methods/

### Gap statistic

- 1. Cluster the observed data, varying the number of clusters from  $k = 1, ..., k_{max}$ , and compute the corresponding total within intra-cluster variation  $W_k$ .
- 2. Generate B reference data sets with a random uniform distribution. Cluster each of these reference data sets with varying number of clusters  $k = 1, ..., k_{max}$ , and compute the corresponding total within intra-cluster variation  $W_{kb}$ .
- 3. Compute the estimated gap statistic as the deviation of the observed  $W_k$  value from its expected value  $W_{kb}$  under the null hypothesis:

$$Gap(k)=rac{1}{B}\sum_{b=1}^{B}log(W_{kb}^*)-log(W_k).$$
 Compute also the standard deviation of the statistics.

4. Choose the number of clusters as the smallest value of k such that the gap statistic is within one standard deviation of the gap at k+1:  $Gap(k) \ge Gap(k + 1) - s_{k+1}$ .

https://www.datanovia.com/en/lessons/cluster-validationstatistics-must-know-methods/#silhouette-coefficient

### Silhouette statistic

For each observation i, the silhouette width  $s_i$  is calculated as follows:

- 1. For each observation i, calculate the average dissimilarity  $a_i$  between i and all other points of the cluster to which i belongs.
- 2. For all other clusters C, to which i does not belong, calculate the average dissimilarity d(i,C) of i to all observations of C. The smallest of these d(i,C) is defined as  $b_i = \min_C d(i,C)$ . The value of  $b_i$  can be seen as the dissimilarity between i and its "neighbor" cluster, i.e., the nearest one to which it does not belong.
- 3. Finally the silhouette width of the observation  $m{i}$  is defined by the formula:

$$S_i = (b_i - a_i)/max(a_i, b_i).$$

https://www.datanovia.com/en/lessons/cluster-validationstatistics-must-know-methods/#silhouette-coefficient

### Dunn index

- 1. For each cluster, compute the distance between each of the objects in the cluster and the objects in the other clusters
- 2. Use the minimum of this pairwise distance as the inter-cluster separation (*min.separation*)
- 3. For each cluster, compute the distance between the objects in the same cluster.
- 4. Use the maximal intra-cluster distance (i.e maximum diameter) as the intra-cluster compactness
- 5. Calculate the *Dunn index* (D) as follow:

$$D = \frac{min.\, separation}{max.\, diameter}$$

https://www.datanovia.com/en/lessons/cluster-validationstatistics-must-know-methods/#silhouette-coefficient

$$DB = \frac{1}{n_c} \sum_{i=1}^{n_c} R_i, \text{ where}$$

$$R_i = \max_{j=1...n_c, i \neq j} (R_{ij}), i = 1...n_c$$

$$R_{ij} = \frac{s_i + s_j}{d_{ij}}$$

$$d_{ij} = d\left(v_i, v_j\right), \quad s_i = \frac{1}{\|c_i\|} \sum_{x \in c_i} d\left(x, v_i\right)$$

#### Where,

- d(x,y) is the Euclidean distance between x and y.
- c<sub>i</sub> is the cluster i.
- · vi is the centroid of cluster ci
- $\|c_i\|$  refers to the norm of  $c_i$

https://www.hackerearth.com/problem/approximate/davies-bouldin-index/

#### Davies-Bouldin index